

Environnement scientifique
et technique de la formation



Matériaux : ingénierie et science
UMR5510
<http://mateis.insa-lyon.fr/>



Centre lyonnais de microscopie
FED4092
<http://www.clym.fr/>

RESPONSABLES

Thierry DOUILLARD
Ingénieur d'études
UMR 5510

Florent DALMAS
Maître de conférences
UMR 5510

Armel DESCAMPS-MANDINE
Ingénieur d'études
UMR 8213

LIEU

VILLEURBANNE (69)

Stage



Microscopie à balayage double faisceaux (FIB / SEM) :
un instrument multiple

DATE DU STAGE

Réf. 16 150 : du lundi 21/03/2016 au vendredi 25/03/2016

OBJECTIFS

- Acquérir ou parfaire les **connaissances théoriques et pratiques** utiles à l'utilisation d'un FIB / SEM
- Appréhender de manière pratique l'acquisition et les 1^{ers} traitements des **données de type 3D**
- Optimiser les **Dépôts *in situ*** et les **usinages FIB** (notamment pour la préparation des **lames TEM**)

INTERVENANTS

N. Blanchard

Institut Lumière Matière, UMR 5306 / Univ. Lyon 1

A. Descamps-Mandine

Laboratoire de Physique et d'Etude des Matériaux, UMR 8213, ESPCI / ParisTech

E. Gautier

Spintronique et Technologie des Composants, UMR 8191, CEA Grenoble

P.H. Jouneau

Laboratoire d'Etude des Matériaux par Microscopie Avancée, CEA Grenoble

F. Dalmas

Matériaux : ingénierie et science,
UMR 5510 / INSA Lyon

C. Langlois

T. Douillard

Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l'Image
pour la Santé, UMR 5220, Univ. Lyon 1

D. Rousseau

A. Delobbe

Orsay Physics, Fuveau France